# 電子顕微鏡による局所分析の新展開

## 1. はじめに

現在では原子の実在性を疑う人はいないと思 われるが、20世紀の初頭にはまだ多くの議論 があったようである.それに解決を与えたのが アインシュタインのブラウン運動の理論とペラ ンの実験であった.それにより、アボガドロ数 の値や原子サイズが明らかにされたが、原子を 観てみたいという願望は残されたままであっ た.本稿では、原子の可視化を夢見て20世紀 に開発された電子顕微鏡技術の進展を概観しな がら、現在では観る道具から分析する装置へと 姿を変えつつある透過電子顕微鏡の最新状況を 紹介する.

#### 2. 20世紀の透過電子顕微鏡

光学顕微鏡の分解能限界はすでに 19 世紀末 にアッベによって明らかにされており,光の波 長よりも小さい物質の観察は不可能と結論され ていたため,原子を観るためには新たな装置の 開発が望まれていた.1924 年にド・ブロイに より物質波の仮説が提出されると,僅か8年後 にドイツのルスカらは電子に対する磁場のレン ズ作用を見出し,光よりも波長の短い電子を用 いた電子顕微鏡を初めて開発した.その後,多 くの研究者たちの努力により,電子顕微鏡の性 能は徐々に向上すると共に,その分解能限界も 明らかにされた.シェルツァーの理論による と,電子顕微鏡の分解能 $\delta$ は電子の波長を $\lambda$ と すると, $\delta = 0.6 \cdot C_s^{1/4} \cdot \lambda^{3/4}$ で表される<sup>1)</sup>.ここ

## 倉田博基\*

で、C。は電子レンズの球面収差係数と呼ばれ、 レンズの不完全さを表すパラメータである.通 常、電子レンズは円筒対称型の磁場分布を与え る電磁石で作られるが、光学レンズとは異なり 凹レンズ作用を形成することができないため. 球面収差を除去することができなかった.この ような状況から、電子顕微鏡で原子を観察する ことは困難を極め、60年代に著されたファイ ンマンの物理学のテキストにもその問題点が指 摘されている.しかし、今日のナノテクノロ ジーの出現を予言したファインマンは、電子顕 微鏡について以下の興味深いコメントを残して いる.「いつかは、電子レンズに固有の収差を 征服して,新しい種類の電子レンズを思いつく 人があるだろう. そうすれば, 原子の写真を直 接とることもできるようになるだろう. いつか は、沈殿物の色を見たりしないで、原子の位置 を見ることによって化合物を分析できるように なるであろう.  $]^{2)}$ 

このファインマンの予言が実現されるには 40年の歳月を要することになる.しかし,電 子レンズの球面収差の問題は未解決のままでは あったが,70年代に原子を可視化することに は成功した.それは、上述の分解能が電子の波 長に強く依存していることに着目し,電子のエ ネルギーを高くし,波長を短くすることで高分 解能を達成しようとする試みであった.京都大 学化学研究所の植田らのグループは,このよう な超高圧電子顕微鏡を開発し,新たな結像法を

\*京都大学化学研究所教授

第275回京都化学者クラブ例会(平成25年5月11日)講演

提案することで,1979年に有機結晶薄膜中の フタロシアニン分子像とそれを構成する原子 の撮影に初めて成功した<sup>3)</sup>.その後の20年間 は高分解能電子顕微鏡学の発展期となり,様々 な材料研究に適用され多くの成果がもたらされ た.この時期の高分解能像はすべて透過電子顕 微鏡(TEM)で撮影されており,その原理は 電子の平面波を結晶に入射し,ブラッグ回折さ れた多数の波の位相をそろえて干渉させるもの で,これが植田らの提案した多波干渉結像法で あった.

一方、TEM とは原理を異にする装置、走査 型透過電子顕微鏡(STEM)もこの時期に登場 した. STEM では、電子線を試料表面上に細 く集束し、それを走査しながら各点を透過した 散乱電子強度を測定し画像化する. 高分解能観 察という観点からは、当初 STEM は TEM に 比べて後れを取っていたが、90年代に入り高 角度円環暗視野(HAADF)法が開発され、一 気に高分解能化が進展し原子分解能観察も実 現された. STEM-HAADF 法の大きな特徴は、 非干渉結像であるという点にある.これは、 TEM のように散乱電子波の干渉を利用しない ため、フォーカス量や試料厚さと言った結像に 関係する条件に鈍感で、なおかつ原子の存在す る位置が明るく、そのコントラストは原子番号 に依存するという特徴を有する. このような利 点があるため像の解釈が容易で.現在では原子 分解能の像を観察する手法としては STEM が 主流になっている.

#### 3. 局所構造解析と元素分析

表題の局所分析という言葉の意味するところ は、電子顕微鏡で観察される非常に微小な領域 の原子配列構造を精確に解析すると同時に、そ こに存在する原子の種類や結合状態を明らかに すると言うことである.これを実現するために 大きな技術革新がなされた.それが,電子レン ズの球面収差補正である.球面収差とはレンズ の中心付近と外側を通過する電子の焦点距離の 違いによるボケである.この球面収差を六極子 レンズの導入により補正しようとする研究が続 けられ,ついに1998年にドイツのグループに より球面収差補正の実現が報告され,200kVの TEM で 0.13nm の分解能が達成された<sup>4)</sup>.その 後,球面収差補正技術の商用化に拍車がかか り,日本でも独自の球面収差補正装置が開発さ れ,2007年に 0.063nm の分解能が達成され<sup>5)</sup>, 電子顕微鏡は新たな時代へ突入した.

このような球面収差補正電子顕微鏡の登場に より、電子の加速電圧が200kV程度でも0.1nm を切る分解能が容易に達成されるようになっ た. 分解能が向上すると結晶中の原子間隔がよ り精確に決定できると同時に、従来の電子顕微 鏡では観察が困難であった軽元素の可視化も可 能になった. 我々のグループでは、球面収差補 正 STEM を用いた円環明視野(ABF)法と呼 ばれる新しい結像法を適用し, 金属酸化物中の 酸素を含む全元素の位置を精確に決定すること で、エピタキシャル薄膜中の精密構造解析を 行っている、その一例として、図1に GdScOa 基板上にエピタキシャル成長した SrRuO<sub>3</sub> 薄膜 の HAADF 像と ABF 像を示す<sup>6)</sup>. HAADF 像 では原子番号に依存したコントラストが得られ るため、基板結晶ではGdとScの原子位置が、 また薄膜内では Sr と Ru の原子位置が明点と して明瞭に観察されている、これより、 基板と 薄膜の界面は破線で示す ScO<sub>2</sub> 面であり、界面 に平行方向の薄膜の格子間隔は GdScO<sub>3</sub> 基板に 整合していることが分かる.一方, ABF 像で は明視野像であるため、HAADF像と比較し コントラストは反転し, 暗点が原子位置に対応



**図1** GdScO<sub>3</sub> 基板にエピタキシャル成長した SrRuO<sub>3</sub> 薄膜 (a) 高角度円環暗視野(HAADF)像(b)円環明視野(ABF)像

する.非常に弱いコントラストではあるもの の、ABF 像では酸素原子位置も可視化されて いる.この画像から,酸素原子位置を数 pm の 精度で決定する方法を構築し、基板および薄膜 内の酸素八面体構造の連結角度を導出した. そ の結果、図2に示すように基板内のScO<sub>6</sub>八面 体は互いに 156°の角度で連結しているのに対 し、薄膜内の RuO<sub>6</sub> 八面体は界面からその角度 が徐々に大きくなり、約4単位胞の距離を離れ ると168°で一定になっていることが明らかに なった. このような界面近傍における八面体連 結角度の変化は、薄膜の基板に対する格子整合 に起因する構造歪みを緩和するために生じてい るものである.酸素八面体の傾斜や歪みはペロ ブスカイト酸化物の物性を左右する重要な因子 であるが、それが界面近傍の局所領域で決定で きるようになったことは、今後の材料研究に とって強力なツールが生まれたと言っても過言 ではない。

上述の例では原子の種類は像のコントラス

トにより決定されていたが、より直接的に元 素分析を行うためには、電子分光法を組み合 わせる必要がある.透過電子顕微鏡に組み込ま れる代表的な分析法に電子エネルギー損失分光 法(EELS)がある.高速電子が試料に入射し 透過する際、試料との非弾性散乱により一部の



図2 SrRuO₃/GdScO₃のABF 像から求められた酸 素八面体連結角度の変化と界面構造モデル

電子はエネルギーを損失する. EELS では、透 過した電子の損失エネルギーを測定することに より元素分析を行う、特に、試料を構成する原 子の内殻電子を励起する場合. それによる損失 エネルギーは元素に固有の値であるため、損失 エネルギーから容易に定性分析を行うことがで きる. さらに,特定元素を励起した非弾性散乱 電子のみを選択し、その強度分布を2次元的に マッピングすることで元素マップを構築するこ とができる. 特に, STEM に EELS を組み合 わせた場合.電子ビームで走査される各点から 内殻励起スペクトルを計測し、それぞれのスペ クトルから元素信号強度を抽出しマップを構築 する. このような手法は古くから知られていた が、原子分解能でそれを可能にするには、上述 の球面収差補正技術の完成が必要であった.非 弾性散乱確率は極めて小さいため(弾性散乱で ある電子回折強度に比べ3桁以上小さい),入 射電子ビームとしては原子サイズに細く絞れる と同時に,大きな電流量が要求され,そのため には球面収差補正が必要であった.2007年に STEM-EELSによる原子分解能の元素マッピン グが実現され<sup>7)</sup>,局所分析という分野が大きく 進展した.

元素マッピング例として SrTiO<sub>3</sub> と SrFeO<sub>25</sub> の界面を観察した結果を図3に示す.(a)は HAADF 像である.2つの結晶を構成する元素 のうち原子番号が一番大きな元素は Sr である ため,HAADF 像中では Sr が最も明るい点と して現れているが,両方の結晶に共通して存 在している.4つの Sr 原子サイトの中心に Ti もしくは Fe が配置しているが,Ti と Fe の原 子番号は接近しているため,画像のコントラ ストだけからではどこが界面か特定できない.



図3 (a)SrFeO<sub>25</sub>/SrTiO<sub>3</sub> 界面の HAADF 像(b)電子エネルギー損失スペクトル(c)Ti マップ(d)Fe マップ

この領域から測定した EELS スペクトルを(b) に示すが、スペクトルには Ti-L<sub>23</sub> 殻、O-K 殻、 Fe-L<sub>23</sub> 殻励起のピークが観察されている. 電子 走査する各点においてこのようなスペクトルを 測定し、Ti と Fe の元素信号強度を抽出し、そ れぞれの強度分布をマップにしたのが(c)、(d) である. この2枚の元素マップから、界面の位 置(破線)が明確に特定できると同時に、ステッ プ構造が存在していることも分かる. さらに、 界面における元素分布は単原子レベルで急峻な 分布にはなっておらず、Ti と Fe が僅かに相互 拡散しており、特に Fe の Ti サイドへの拡散 が顕著であることが分かる.

#### 4. 今後の展開

上に示した元素マッピングでも分かるよう に,原子分解能で元素の分布が可視化されると いうことは,まさにファインマンが予言してい た「*原子の位置を見ることによって化合物を分 析できる*」ことが実現したことを意味する.原 子を観てその分析もできるようになった現在,次に目指すべき方向はどのあたりにあるのだろ うか?

局所分析の目的には、元素の分析だけではな く結合状態を明らかにすることも含まれてい る.上述の例で言えば、遷移金属元素と酸素と の結合状態を原子レベルで分析できれば究極の 化学分析になると言える.EELS で測定される 内殻電子励起スペクトルの吸収端近傍には、物 質の非占有バンドの状態密度分布を反映した微 細構造が現れる.それを解析することで化学結 合状態について情報を得ることができる.この ような微細構造を詳細に解析するためには、元 素マッピングの場合に比べて、より高いエネル ギー分解能が要求される.そのために、入射電 子線のエネルギーを単色化するモノクロメータ の開発が進展してきており、0.1eVの分解能で スペクトルを計測することが可能になってき た.しかし、モノクロメータを利用するとエネ ルギー分解能は向上するものの、入射電流量が 低下するため、原子レベルの空間分解能でスペ クトル計測を行い、その結果を2次元のマップ にするには長時間の測定時間を要することにな り、装置全体の安定性等が問題になってくる. 現在までのところ、高エネルギー分解能のスペ クトル情報を2次元に可視化した例はないが、 0.9eVのエネルギー分解能で遷移金属酸化物中 の結合状態の異なる酸素のマッピングには成 功しているため<sup>8)</sup>、今後はより詳細な結合状態 マップが可視化されることが期待される.

## 参考文献

- 1) O. Scherzer, J. Appl. Phys. 20, 20 (1949).
- R. Feynman, "ファインマン物理学" 第4巻, p.116 (1965)(岩波書店)
- N. Uyeda, T. Kobayashi, K. Ishizuka and Y. Fujiyoshi, *Chemica Scripta*, 14, 47 (1978-79).
- 4) M. Haider, S. Uhlemann, E. Schwan, H. Rose, B. Kabius and K. Urban, *Nature*, **392**, 768 (1998).
- H. Sawada, F. Hosokawa, T. Kaneyama, T. Ishizawa, M. Terano, M. Kawazoe, T. Sannomiya, T. Tomita, Y. Kondo, T. Tanaka, Y. Oshima, Y. Tanishiro, N. Yamamoto and K. Takayanagi, *Jpn. J. Appl. Phys.* 46, L568 (2007).
- 6) R. Aso, D. Kan, Y. Shimakawa and Hiroki Kurata, *Sci. Rep.* **3**, 2214 (2013).
- 7) K. Kimoto, T. Asaka, T. Nagai, M. Saito, Y. Matsui, and K. Ishizuka, *Nature*, **450**, 702 (2007).

8) M. Haruta, K. Kurashima, T. Nagai, H. Komatsu, Y. Shimakawa, H. Kurata, and

K. Kimoto, *Appl. Phys. Lett.* **100**, 163107 (2012).